Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/537,368	MURANAKA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Anh T.N. Vo	2861	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
ipolate	y Alon	ch 1210	J M
	_		

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
347	86	12/19/2007	W		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
		DATE	EXMR	
	;			
		·		
·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	į			
	<u> </u>	· .		